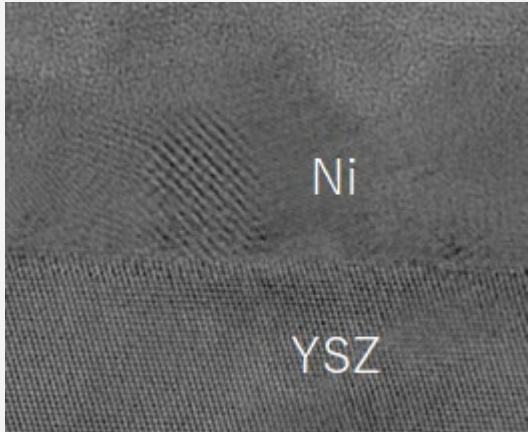


## NOF報告書例（報告書は非公開）

利用年度(Fiscal Year for the Use of Facility)	2020年度
課題ID(Subject ID)	20-00**-A-TEM
利用課題名(Subject Title)	Ni/YSZ界面変化の高温加熱ホルダーによるその場TEM観察
所属機関(Affiliated Institution)	株式会社****
利用者名(Applicant)	電頭花子
利用先(Name of Station)	電子顕微鏡解析ST
支援担当者(Staff in Charge)	****
利用形態(Style of the Use of Facility)	機器利用
内容(Details)	<p>MEMS chip型加熱ホルダーにFIB加工したNi/YSZ試料を載せ、TEM内で高温時における界面の変化の様子をその場観察した。 使用した装置はJEM-ARM200Fである。 OneViewISを用い、ドリフト補正機能を使うことで、高分解能観察が可能であった。 500度まで加熱を行ったが界面に大きな変化は生じなかった。</p>  <p>図表は任意</p>